

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
60384-2

1982

QC 300400

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1987-02

Amendement 1

**Condensateurs fixes utilisés dans les
équipements électroniques**

Partie 2:

Spécification particulière-cadre: Condensateurs
fixes pour courant continu à diélectrique en film
de polytéréphtalate d'éthylène métallisé
Niveau d'assurance E

Amendment 1

**Fixed capacitors for use in electronic
equipment**

Part 2:

Blank detail specification: Fixed metallized
polyethylene-terephthalate film dielectric
d.c. capacitors
Assessment level E

© CEI 1987 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

C

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

PREFACE

La présente modification a été établie par le Comité d'Etudes n° 40 de la CEI: Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Le texte de cette modification est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapports de vote
40(BC)591 40(BC)598 40(BC)599	40(BC)645 40(BC)646 40(BC)647

Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports de vote correspondants mentionnés dans le tableau ci-dessus.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

Page 2

Ajouter les paragraphes suivants:

4.14	Résistance du composant aux solvants	50
4.15	Résistance du marquage aux solvants	50

Page 20

TABLEAU I

Ajouter les essais suivants:

- Groupe 1A

Ajouter l'essai suivant après l'essai de la résistance à la chaleur de soudage:

4.14 Résistance du composant aux solvants

- Groupe 1B

Ajouter l'essai suivant après l'essai de soudabilité:

4.15 Résistance du marquage aux solvants

PREFACE

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee No. 40: Capacitors and Resistors for Electronic Equipment.

The text of this amendment is based upon the following documents:

Six Months' Rule	Reports on Voting
40(C0)591 40(C0)598 40(C0)599	40(C0)645 40(C0)646 40(C0)647

Further information can be found in the relevant Reports on Voting indicated in the table above.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Page 3

Add the following sub-clauses:

4.14 Component solvent resistance	51
4.15 Solvent resistance of the marking	51

Page 21

TABLE I

Add the following tests:

- Group 1A

Add the following test after Resistance to soldering heat:

4.14 Component solvent resistance

- Group 1B

Add the following test after Solderability:

4.15 Solvent resistance of the marking

Page 22

TABLEAU II

Ajouter l'essai suivant en Groupe 1A, après l'essai de la résistance à la chaleur de soudage:

4.14 Résistance du composant aux solvants (si applicable)	Solvant: ... Température du solvant: ... Méthode 2 Reprise: ...	Voir la spécification particulière
---	--	------------------------------------

Page 24

TABLEAU II

Ajouter l'essai suivant en Groupe 1B, après l'essai de la soudabilité.

4.15 Résistance du marquage aux solvants (si applicable)	Solvant: ... Température du solvant: ... Méthode 1 Matériau de frottement: ... Reprise: ...	Marquage visible
--	---	------------------

Page 26

TABLEAU II, Groupe 1

Supprimer toutes mesures et exigences spécifiées comme 4.10.2.1, 4.10.4.1 et 4.10.4.2.

Pages 44 et 46

Paragraphe 4.10: *Séquence climatique*

Supprimer dans les paragraphes 4.10.2 et 4.10.4: ", compte tenu des modalités suivantes:"

Supprimer les paragraphes 4.10.2.1, 4.10.2.2, 4.10.2.3, 4.10.4.1 et 4.10.4.2.

Page 50

Ajouter les paragraphes suivants:

4.14 *Résistance du composant aux solvants*

Selon paragraphe 4.31 de la Publication 384-1 de la CEI.

4.15 *Résistance du marquage aux solvants*

Selon paragraphe 4.32 de la Publication 384-1 de la CEI.